

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40℃ ～ +105℃	保存温度範囲	-40℃ ～ +105℃	
	電 流	1 A	電 圧	AC 250 V	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	30 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	30 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 500Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的 性能	繰り返し動作	30回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 20 ～ 200 Hz、 加速度43.1 m/s ² で3方向各3時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	熱 衝 撃	温度-40→5→35→105→5→35℃ 時間 30 → 5 → 30 → 5 分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗： 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐 寒 性 	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗： 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	—
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm、8時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	指定の温度プロファイルに2回通して試験する。	外観の変形及び端子などに著しいガタの無いこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃、浸せき時間 3秒のはんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が新しいはんだでぬれていること。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	1	DIS-T-00011936	HK. WATANABE	MH. YAMAGUCHI	20211111
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 適合基板厚は0.8mm。 (注3) 環境・耐久試験後の外部導体の接触抵抗は、120mΩ以下。			承認	KI. HIROKAWA	20200406
			検 図	MO. OKADA	20200406
			担 当	HK. WATANABE	20200406
			製 図	YK. MITSUISHI	20200403
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-168420-55-00	
	製品規格表		製品名	GT21T-1P-H(55)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0771-0014-0-55	 1/1